

2026 アルバック・ファイ ユーザーズミーティング

日時：2026年2月6日(金) 13:00~17:00

会場：ホテル グランヴィア京都

JSR 株式会社 中村 立 様

高分子材料開発における表面分析の活用事例のご紹介

弊社で取り扱う電子材料等向け高分子材料の開発においては、狙いの構造・分布を有する膜を形成するように原料溶液の構成成分を設計することが重要であり、その評価のために表面分析が活用されています。本発表では高分子薄膜材料への表面分析（イメージング・デプスプロファイリング）の適用事例について、分析上の課題とそれに対する取り組みを交えて紹介します。

積水化学工業株式会社 李 艶 様

機械学習によるTOF-SIMSおよびXPSの活用事例紹介

近年、材料の複雑化に伴い TOF-SIMS および XPS データの解釈が難しくなっており、効率的に解析するために機械学習の導入を検討しました。本講演では、TOF-SIMS データの機械学習による未知物質のスペクトル予測について紹介します。また、TOF-SIMS および XPS から得られた膨大なデータから有用な情報を引き出すために、マルチモーダル解析に着目し、性能に影響を与えるスペクトルを予測し、問題解決に繋がった事例を紹介します。

株式会社東レリサーチセンター 宮田 洋明 様 坂田 智裕 様

東レリサーチセンターにおけるXPSを中心とする 表面分析の事例紹介

東レリサーチセンターは、前身の東レ株式会社中央研究所時代に XPS を導入してから半世紀を超え、産業界や学术界の様々な課題に対して多くの受託分析の経験をもとに、最新の装置を導入し継続的に技術開発を進めてきました。本発表では PHI GENESIS を用いた XPS の分析事例やシンクロトロン放射光を活用した電子分光など、弊社独自の表面分析の事例をご紹介させていただく予定です。